

散裂中子源质子 束流望远镜系统 的研制

李岚坤 ^{1,3} ,董明义 ^{1,2} ,高泽 ^{1,3}
金梁程龙1,章红宇1,喻英豪4,
敬罕涛1,樊瑞睿1,郭宇航1,董静1
1.核探测与核电子学国家重点实验室,中国 科学院高能物理研究所
2.中国科学院大学
3.郑州大学,物理学院
4、南华大学,核科学技术学院

July.17.2024





- 高能质子实验终端
 □ 整体介绍
 - □ 谱仪探测系统
- 束流望远镜系统
 - □ 整体设计
 - □ 探测模块
 - □ 电子学系统
- 束流实验初步测试
 - □ 分析算法
 - □ 实验结果



HPES 高能质子实验终端 (HPES)

- □ CSNS二期建设的实验线站之一
- □ 国内唯一一台专用高能粒子测试束线
- □ 束流能量 0.8 ~ 1.6 GeV
- □ 通过环散射器引出准单粒子束流
- 具有能量高、能散小、准直性好、事例率
 高等优点
- □ 探测器研发过程中不可或缺的测试工具











- □ 束流望远镜系统:
 - > HPES谱仪探测系统的核心
 - > 由6层硅像素探测器组成
 - 高能质子垂直穿过6层望远镜系统和DUT (束流沿方向)

束流望远镜

- > 为待测设备 (DUT) 提供高精度的参考径 迹
 - 参考径迹在DUT测量平面的投影和DUT 测量位置的残差→DUT空间分辨率



□ 主要性能参数设计目标:

主要参数设计目标	HPES质子束流望远镜
望远镜层数	6
灵敏区面积 / cm ²	$> 3 \text{ cm}^2$
单层物质量 / % X ₀	< 0.10
径迹位置分辨率 / μm	<10@1.6GeV





束流望远镜

- □ 束流望远镜系统主要组成:
 - 6层望远镜探测模块,包括MAPS型硅像素芯片、 前端PCB板和屏蔽盒
 - 电子学系统,用于配置芯片、提供电源和外部时 钟、数据打包和传输等
 - DAQ系统,进行望远镜探测模块的独立控制和数据接收,并提供在线监测功能
 - > 触发探测器+触发逻辑单元提供触发信号
 - > 冷却系统和高精度实验测试台等



启动信

号控制

系统时

钟

触发扇

出

Power



- → 束流望远镜
- □ 望远镜系统的模拟:
 - ▶ 模拟能量: 1.6 GeV的质子源
 - > 探测器模型:6层望远镜系统+DUT,每层物质量为 0.088% X₀,间距20 mm
- ▶ 芯片像素尺寸设置为: 20.7 µm
 空间分辨率:
 - > DUT的测量残差~4.8 μm

DUT的测量残差:
$$\sigma_{\text{meas}}^2 = \sigma_{\text{DUT}}^2 + \sigma_{tel}^2$$

 $\sigma_{tel}^2 = k\sigma_{\text{DUT}}^2$
 $k = \frac{\sum_i^N z_i^2}{N\sum_i^N z_i^2 - (\sum_i^N z_i)^2}$
DUT的空间分辨率 ~ 4.4 µm

> 望远镜系统的空间分辨率约 2 μm







□ 多次库伦散射:

 $\theta_0 = \frac{13.6 \, MeV}{\beta cp} Z \sqrt{\frac{x}{X_0}} \left(1 + 0.038 \ln\left(\frac{x}{X_0}\right)\right)$

束流望远镜

□ 多次库仑散射带来的位置偏差:

 $L = d\theta_0$

减少物质量,减少DUT与前后望远镜层
 的间距,或减少望远镜层之间的间距都
 可以有效提高DUT的位置测量精度







望远镜探测模块 望远镜探测模块

- □ 采用MIMOSA-28芯片
 - 像素尺寸20.7 μm → 空间分辨好于5 μm
 - > 芯片尺寸22.22 mm × 22.71 mm → 灵敏区面积 约3.8 cm²
 - > 读出时间为185.6 μs
- □ 前端PCB板
 - 采用镂空设计,低物质量的镂空区域的面积约
 3.6 cm²,物质量约0.088%X₀ (50 μm Si + 100 μm Kapton遮光薄膜)
 - > 通过FMC接口连接到后端电子学系统
- □ 铝制屏蔽盒用于保护芯片
- □ 搭建了6层束流望远镜的初步测试系统
 - 通过滑轨改变望远镜层间距
 - > 通过水冷降低探测模块温度







(c) 完成芯片工装





电子学系统

电子学系统

- 前端PCB板,通过FMC接口连接后端电子学系统
 数字读出板,用于配置芯片、提供电源和时钟信号, 数据的接收、打包和传输等
- > Start信号扇出板,接收并分发Start和Stop控制信号
- > 外部时钟扇出板,用于提供100 MHz的外部时钟
- 初步测试系统中采用闪烁体提供脉冲信号作为触发,
 并通过触发扇出板分发给探测模块





数字读出板



Start扇出板





触发扇出板



高精度实验测试台

> 6层望远镜探测模块分别安装在两个探测器共架支架

实验测试台

- > DUT安装在六轴运动测试台→实现DUT在z方向的前 后移动和任意方向的调节,最大行程±30mm,转动 角度±12°,重复定位精度在0.001mm以内。
- 一层导轨用于调节DUT和望远镜系统的间距,总长 3.2 m
- 二层导轨用于调节望远镜探测模块的间距,总行程为1 m
- 6个探测器调节支架用于校准望远镜系统的位置





初步测试

- 望远镜系统束流实验
- □ **束流能量**~1.3 GeV, 能散较大
- □ 探测器系统
 - > 6层望远镜系统,以第三层为DUT
 - 望远镜系统每层间距为25 mm
- □ 闪烁体提供触发信号
- 初步研究束流望远镜系统在不同阈值、间 距和物质量下的空间分辨率和探测效率







离线分析软件

- 为待测设备提供探测器校准、参考径迹的重建和性能分析
- 主要功能包括:
 - 数据解包 (Decoding)
 - 簇团重建 (Clustering)
 - · 径迹寻迹 (Track Finding)
 - 探测器校准 (Detector Alignment): 基于最小
 卡方的校准算法
 - 径迹重建(Track Fitting):基于最小卡方的径 迹重建算法或基于Kalman滤波的径迹重建算法





□ DUT测量残差

- 束流能量~1.3 GeV, 以第三层作为DUT \geq
- DUT测量残差~6.3 μm (阈值5.5 σ) \succ
- □ DUT空间分辨率

10000

8000

Counts

4000

2000

DUT空间分辨率约5.7 μm, 望远镜分辨率: ~ 2.7 μm

测试结果

□ DUT的探测效率好于99.5%





DUT的测量残差随阈值的变化关系







-100-80-60-40-20 0 20 40 60 80 100

 ΔV [um]

6000

4000

2000

物质量为1.2%X0时

DUT的测量残差分布

6000

4000

2000

-100-80-60-40-20 0 20 40 60 80 100

 $\Delta U [um]$





15



> 完成了6层质子束流望远镜系统的设计,望远镜系统的分辨预
 期约 2 μm

总结

- ➤ 研制了物质量为0.088%X₀的望远镜探测模块,初步搭建了6层 束流望远镜测试系统,验证了探测模块的功能正常
- 通过束流实验初步测试了6层束流望远镜系统的性能,在1.3
 GeV时, DUT的空间分辨率~5.7 μm,望远镜系统的空间分辨
 率~2.7 μm,探测效率好于99.5%
- 后续将进行望远镜系统的优化、电子学系统的升级,和离线分析软件的开发等工作

Thanks for your attention !

Back up

高精度贴片及打线

- ▶ 通过L型定位面精确摆放芯片
- ▶ 打开抽气系统,移走L型定位面
- ▶ 通过定位销和PCB板上的定位孔精确放置前端芯片 板
- ▶ 探测模块均匀受压以充分粘接
- ▶ 使用Hesse BJ855全自动引线键合机完成打线





(a) 芯片放置





(c) 完成芯片工装









功能测试

束流望远镜系统研制进展

- 已完成全部望远镜探测模块的阈值
 扫描测试
 - → MIMOSA芯片甄别器阈值电压设置: $\Delta V = V_1 - V_2$
 - MIMOSA28芯片被分为4个Bank,通过4个 Bank独立的寄存器V1和芯片共用的V2设 置阈值
 - ➢ 芯片噪声可分为固态模式噪声FPN和暂态 噪声TN
 - ▶ 芯片噪声定义为:
 - $\sigma = \sqrt{FPN^2 + TN^2}$
 - > 甄别器阈值设置:

 $Mean_{FPN} + n\sigma$





功能测试

束流望远镜系统研制进展

- 已完成全部望远镜探测模块的阈值 配置,在阈值 > 5.5 σ时,噪声引起 的FakeHitRate < 10⁻⁶
- ✓ 通过⁵⁵Fe放射源验证了探测模块的 响应、DAQ系统取数和数据解包等 功能正常
- 已完成了6层望远镜探测模块的同步读出,长时间工作状态下触发号和帧号完全对齐







□ 模拟残差

> 模拟残差~5.6 µm → 模拟未考虑能散



阈值为5.5 σ时DUT的测量残差分布

Allpix2模拟所得的DUT测量残差分布



探测器校准: 探测器校准: 第一步 获取探测器初始偏移: ▶ 校准参数M: > 方法: 径迹入射方向基本垂直 测量残差 于芯片→相邻两层同一径迹产 生的击中坐标残差分布均值= 相邻两层XY方向的偏移 雅可比矩阵 $M^{T} = \left(JJ^{T}\right)^{-1}Jr = \sum_{i}^{N}J_{j}J_{j}^{T}\sum_{i}^{N}J_{j}r_{j}$

探测器校准

▶ 使用最小卡方算法或线性回归的方式计算六个校准参数 $\mathbf{M} = (\Delta u, \Delta v, \Delta w, \Delta \alpha, \Delta \beta, \Delta \gamma)$ > 测量残差和校准参数的关系可以表示为:

$$r_j = J_j^T M^T \qquad r_j = \begin{pmatrix} u_j^c - u_j \\ v_j^c - v_j \end{pmatrix}$$

 $J_j^T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \tan\phi & v_j \tan\phi & u_j \tan\phi & v_j \\ 0 & -1 & \tan\psi & v_j \tan\psi & u_j \tan\psi & -u_j \end{pmatrix}$

其中tanφ和tanψ分别是径迹在XZ和YZ平面的斜率

➢ 构造函数和线性回归计算校准参数M

▶ 校准后的精度好于0.5 µm

径迹重建

径迹重建: ▶ Kalman滤波径迹拟合,通过协方差矩阵引入多次库伦散射 ▶ 最小二乘法拟合,获得径迹初始参数(x₀,y₀和斜率) ▶ 预测:根据状态传递模型F_k预测径迹参数和协方差矩阵 $\hat{x}_{k}^{k-1} = F_{k-1}\hat{x}_{k-1}$ $C_{k}^{k-1} = F_{k-1}C_{k-1}F_{k-1}^{T} + Q_{k-1}$ ▶ 计算Kalman增益: 根据测量模型H_k和协方差矩阵计算Kalman增益 $K_k = C_k^{k-1} H_k^T \left(H_k C_k^{k-1} H_k^\top + U_k \right)^{-1}$ > 更新: 根据测量值和预测值的残差更新径迹参数及协方差矩阵 $\hat{x}_{k}^{k} = \hat{x}_{k}^{k-1} + K_{k} \left(m_{k} - H_{k} \hat{x}_{k}^{k-1} \right)$ $C_k^k = (I - K_k H_k) C_k^{k-1}$ ▶ 计算平滑增益: $S_k = C_k \cdot F^T \cdot \left(C_k^{k-1}\right)^{-1}$ ▶ 反向平滑: $\hat{x}_{k-1}^{s} = \hat{x}_{k-1} + S_k \left(\hat{x}_k^{s} - \hat{x}_k^{k-1} \right)$ $C_{k-1}^{s} = C_{k-1} + S_k \left(C_k^s - C_k^{k-1} \right) S_k^T$

径迹参数: $x_0 + z_0 \tan \theta x$ $\hat{x} = \begin{bmatrix} p_2 \\ p_3 \\ p_3 \end{bmatrix} = 1$ $y_0 + z_0 \tan \theta_x$ $\tan \theta_x$ $\tan \theta_{\nu}$ 状态传递模型 $\hat{x}_k = F_{k-1}\hat{x}_{k-1} + w_k - 1$ $= \begin{pmatrix} 1 & 0 & d_z & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_z \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ dx \\ dy \end{pmatrix} + Q_k$ 测量模型: $\hat{m}_k = H_k \hat{x}_k + \epsilon_k$ $= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ dx \end{pmatrix} + V_k$ 多次库仑散射的协方差矩阵可 以表示为 $Q_{k} = \begin{pmatrix} z_{0}^{2} \langle P_{3}, P_{3} \rangle & z_{0}^{2} \langle P_{3}, P_{4} \rangle & z_{0} \langle P_{3}, P_{3} \rangle & z_{0} \langle P_{3}, P_{4} \rangle \\ z_{0}^{2} \langle P_{3}, P_{4} \rangle & z_{0}^{2} \langle P_{4}, P_{4} \rangle & z_{0} \langle P_{3}, P_{4} \rangle & z_{0} \langle P_{4}, P_{4} \rangle \\ z_{0} \langle P_{3}, P_{3} \rangle & z_{0} \langle P_{3}, P_{4} \rangle & \langle P_{3}, P_{3} \rangle & \langle P_{3}, P_{4} \rangle \end{pmatrix}$ $z_0 \langle P_3, P_4 \rangle \quad z_0 \langle P_4, P_4 \rangle \quad \langle P_3, P_4 \rangle \quad \langle P_4, P_4 \rangle$ $< P_{3}, P_{3} >= \sigma^{2}(\theta) \left(1 + P_{3}^{2} + P_{4}^{2}\right) \left(1 + P_{3}^{2}\right)$ $< P_{3}, P_{4} >= \sigma^{2}(\theta) \left(1 + P_{3}^{2} + P_{4}^{2} \right) (P_{3}P_{4})$ $< P_4, P_4 >= \sigma^2(\theta) \left(1 + P_3^2 + P_4^2\right) \left(1 + P_4^2\right)$

24